

AI・IoT技術セミナー
それぞれの現場に適した異常診断手法を獲得するために
一良品学習（MTシステム・機械学習）の体系一
開催のご案内

主催：石川県工業試験場

AI・IoT技術の進展によって製造現場における製品や設備の異常診断に対するニーズが高まっており、実際にやってみようと考えている方も多いかと思えます。

しかし、いざ調べてみるとその手法の多さに驚くのではないのでしょうか。残念ながら、ある一つの手法が何に対しても有効というものはなく、皆様が扱う現場に応じて多くの手法から課題に適したものを選択しなければなりません。そのためにはそれぞれの手法の特徴を体系的に理解しておく必要があります。

本セミナーでは受講者の皆様の武器を増やすことを目的とし、異常診断の中心と考えられる良品学習を対象として計算コストや実績に優れるMTシステムや、より大規模かつ複雑なデータを対象とする機械学習手法を紹介いたします。さらに、webブラウザでプログラムを実行可能なJupyter Notebookを活用して、各種アルゴリズムを実際に動かし処理の流れやその特徴を分かりやすく解説します。

多数ご参加下さいますようご案内いたします。

[日 時] 令和2年3月16日（月） 14:00～17:00

[場 所] 石川県工業試験場 2階 第2会議室（金沢市鞍月2丁目1番地）

[講 師] 国立研究開発法人産業技術総合研究所

製造技術研究部門 生物化学プロセス研究グループ

主任研究員 **石田 秀一 氏**

[受講料] 無料

[定 員] 30名

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地

石川県工業試験場 担当：米沢、笠原

e-mail: seminar020316@iriii.jp TEL: (076) 267-8084 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 令和2年3月9日（月）（定員になり次第締切ります）

————— 受講者は下記内容を記入してお申込みください —————

AI・IoT技術セミナー：「それぞれの現場に適した異常診断手法を獲得するために」

会 社 名

住 所(〒)

電 話

所 属	氏 名	e-mail